

Список основных работ официального оппонента по теме диссертации Молодых А.А. кандидата технических наук, доцента, доцента кафедры общей и технической физики Санкт-Петербургского горного университета Иванова Алексея Сергеевича.

Статьи в журналах

1. Федорцов А. Б., Чуркин Ю. В., Манухов В. В., Иванов А. С., Быстродействующий прибор для контроля угловой зависимости коэффициента отражения лазерного луча / Известие ВУЗов. Приборостроение, № 3, V 54, 2011. pp. 61 - 64.
2. Федорцов А. Б., Манухов В. В., Гончар И. В., Иванов А. С., Автоматизированный быстродействующий лазерный интерферометр для контроля толщины твердых и жидких пленок. / Известия ВУЗов. Приборостроение, № 5, V 55, 2012. pp. 72 - 79.
3. Федорцов А. Б., Гончар И. В., Иванов А. С., Быстродействующий интерферометрический измеритель толщины пленок в диапазоне от десяти до тысячи микрон. / Научно-технические ведомости СПбГПУ, серия "Физ.-мат.науки", № 3, Т, 2012. С 22 - 28.
4. Федорцов А. Б., Манухов В. В., Иванов А. С., Лазерно-интерференционный метод определения длины диффузии носителей заряда в полупроводниках. / Физика и техника полупроводников, № 9, V 49, 2015. С 1153 - 1159.
5. Федорцов А. Б., Манухов В. В., Иванов А. С., Laser interferometric method for determining the carrier diffusion length in semiconductors / Semiconductors, № 9, V 49, 2015. С 1119 - 1124.

Публикации в сборниках, трудах, конференций

1. Букина М. Н., Бармасов А. В., Иванов А. С. Современные методы обучения при преподавании физики и концепций современного естествознания. // Санкт-Петербург: Горный университет, Т 1, 2015. С 516 - 520.
2. Букина М. Н., Иванов А. С., Бармасов А. В. Современные методы обучения при преподавании общей физики и математической обработки результатов измерений физических величин. // Санкт-Петербург: Горный университет, Т 1, 2014. С 408 - 414.
3. Федорцов А. Б., Иванов А. С. Опыт проведения дифференцированного зачета в письменной форме.. // Санкт-Петербург: Горный университет, Т 2, 2016. С 307 - 310.
4. Федорцов А. Б., Иванов А. С. Развитие метода Ояма-Мори для контроля толщины оптически прозрачных диэлектрических слоев.. // Санкт-Петербург: РГПУ им.А. И. Герцена, Т 2, 2014. С 74 - 77.
5. Федорцов А. Б., Иванов А. С., Гончар И. В. Лазерный интерферометрический метод контроля толщины пленок и прибор для его реализации.. // Москва: МИФИ, Т 1, 2013. С 32 - 34.
6. Федорцов А. Б., Манухов В. В., Иванов А. С. Бесконтактный метод определения длины диффузии носителя заряда в полупроводниковых пластинках.. // Санкт-Петербург: Политехнический университет, Т 2, 2014. С 126 - 136.

7. Федорцов А. Б., Гончар И. В., Иванов А. С. Лазерный интерферометр для контроля толщины оптически прозрачных материалов.. //Санкт-Петербург: Политехнический университет , Т 1, 2013. С 9 - 19.
8. Федорцов А. Б., Гончар И. В., Иванов А. С. Многократное повышение точности лазерно-интерферометрического определения толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок в диапазоне от 10 мкм до 1мм.. //Санкт-Петербург: Политехнический университет , Т 2, 2012. С 93 - 106.